実験ステーション(共用ビームライン)

# BL13XU 表面界面構造解析

### 1.はじめに

2001年10月から2002年7月までに、本ビームラインBL13XU に関して英文で報告済みのものは1]と[2]であり、また、 発行準備中のものは3]である。本ビームライン運用後、 今回の年報が和文によるBL13XUに関する最初の記事で ある。そこで、ビームラインの構成をまず掲載し、次に上 記期間における変更点などを紹介する。さて、表面・界面 の構造研究では、対象が希薄であるため、安定、かつ、大 きなX線光子密度と可能な限り低いバックグランド強度 環境の作成が要請される。今回の報告は、前者の安定、か つ、大きな光子密度に関係している。

### 2. ビームラインの構成

ビームラインの基本構成の設計に関しては(4)の記事を 参考にしてください。X線を発生する挿入光源、X線ビー ムの条件を整えるフロントエンド、光学ハッチと測定を行 う実験ハッチの4個から構成される。その構成要素は SPring-8標準型真空アンジュレータ、フロントエンド部、 液体窒素冷却型モノクロメータ、横ふり型の2枚のミラー である(図1)。3個の実験ハッチがある。最上流の実験 ハッチ1では主に大気中の実験のための回折計が利用でき る。最下流の実験ハッチ3には超高真空内におかれる結晶 性物質の表面構造解析システムが設置されている。挿入光 源から、実験ハッチ3の端の壁まで、約80mである。



Figure 1: BL13XUの構成。実験ハッチ3の内側が模式図で示 されている。

# 3.1年間の更新内容と作業内容

あ) 光学ハッチ内のモノクロメータのステージの一部変 更(2002年1月)い)実験ハッチ1に2台の回転台(1 arc sec/100 pulse step)と精密実験台(縦180cm,横90cm, 高さ91cm)の導入と設置(2001年11月)う)実験ハッチ 3内に設置されている表面構造解析システムの高さの安定 度の調査(2002年1月)の3点ある。今回紹介するのは、 あ)と、う)である。

#### 31 モノクロメータのステージの一部変更



 Figure 2:モノクロメータ結晶台の変更後。第2ステージ部分の拡大図。

# 32 表面構造解析システムの高さの安定度の調査

表面構造解析システムは、回折計部(10 ton)と超高真 空チャンバ部(1 ton)から成る。このシステムを運用す る際、チャンバの取外し作業と再び搭載する作業を定常的 に行う。回折計部の土台の13カ所に位置ゲージをセットし、



Figure 3:モノクロメータ結晶のステージの温度変化の例。

超高真空チャンバを乗せ直して、そのシステムの高さが変 化するかどうかを調査した(参考図4)。その結果、その真 空チャンバを乗せた場合、システム全体が15µm沈むこと を観察した。その後、15時間そのシステム全体は一定の高 さを保った。問題なしと結論した。



Figure 4:表面構造解析システムの全体像と調査箇所のいくつ かの測定の様子。

3 3 ビームラインモノクロメータからのX線のフラックス 測定

アンジュレータのギャップ位置を固定し、ビームライン モノクロメータからのX線の光子数の測定を、複数の ギャップ値について繰り返した。Siピン・フォト・ダイ オードを用い、光子数を検出した。その検出器のBe窓の 厚みの吸収補正とダイオードの厚さから関係する検出効率 を考慮後の結果が図5である。フロントエンドにあるグラ ファイト・フィルタの厚さは0.3mm、X線が実験ハッチ1に 至るまでに通過するBe窓の厚さは合計0.75mm でした。測 定時に用いたフロントエンド・スリットの開口は横1mm縦 0.8mm でした。



Figure 5:X 線のフラックス測定の結果。

実験ステーション(共用ビームライン)-

References

- [1] O Sakata et al ., SPring-8 Information , 6 , 450( 2001 ).
- [2] O.Sakata, PF研究会、プロシーディングス X 線中性 子線反射率 / 散乱法による薄膜・多層膜の構造解析 Dec. 2001.
- [3] O Sakata et al ., Submitted to Surface Review and Letters.
- [4]後藤俊治,竹下邦和,石川哲也,SPring-8利用者情報 誌,5,100(2000).
- [5] K .Tamasaku et al . ,Proc .SPIE 4782 ,to be published .

利用研究促進部門 構造物性 グループ・表面構造チーム 坂田 修身・田尻 寛男